PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-215365

(43)Date of publication of application: 10.08.2001

(51)Int.Cl.

G02B 6/42

(21)Application number: 2000-027388

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

31.01.2000

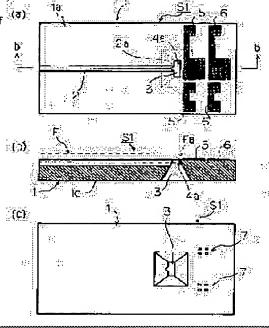
(72)Inventor:

HIRAOKA MICHIAKI

(54) BASE PLATE FOR MOUNTING OPTICAL PARTS AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a base plate for mounting optical parts, as well as providing its manufacturing method, a base plate capable of highly efficiently and stably performing optical coupling between a semiconductor element and an optical waveguide body that are mounted on the same base plate, and also capable of miniaturization and reliability. SOLUTION: The base plate S1 for mounting optical parts is characterized by the formation of a V-groove 2 for loading the optical waveguide body F on the plate 1 and the formation of a through-hole 3 for determining the end position of the optical waveguide body F at one end of the V-groove 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-215365 (P2001-215365A)

(43)公開日 平成13年8月10日(2001.8.10)

(51) Int.Cl.7 G 0 2 B 6/42 識別記号

FI G02B 6/42

テーマコート*(参考) 2H037

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願2000-27388(P2000-27388)

(22)出願日

平成12年1月31日(2000.1.31)

(71)出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

(72)発明者 平岡 通明

京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京

セラ株式会社中央研究所内

Fターム(参考) 2H037 AA01 BA02 BA11 DA03 DA04

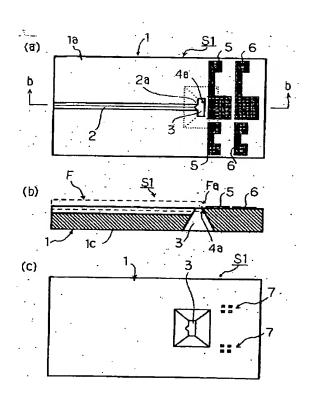
DA06 DA12

(54) 【発明の名称】 光部品実装用基板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 同一基板上に搭載する半導光体素子と光導波体との光結合を高効率かつ安定に行うことが可能で、しかも小型化可能で信頼性にも優れた光部品実装用基板及びその製造方法を提供すること。

【解決手段】 基板 1 に、光導波体 F を搭載する V 溝 2 と、該 V 溝 2 の一端部に光導波体 F の端部位置を定めるための貫通孔 3 が形成されていることを特徴とする光部品実装用基板 S1 とする。



20

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に、光導波体を搭載するV溝と、 該V溝の一端部に前記光導波体の端部位置を定めるため の貫通孔が形成されていることを特徴とする光部品実装 用基板。

1

【請求項2】 前記基板は異方性エッチングが可能な材料から成り、前記V溝及び前記貫通孔を異方性エッチングで形成したことを特徴とする請求項1に記載の光部品実装用基板。

【請求項3】 前記基板の表面からの異方性エッチン 10 グにより前記 V 溝を形成する工程と、前記 V 溝の一端部 に対応する基板裏面の部位からの異方性エッチングにより貫通孔を形成する工程とを順次行うことを特徴とする 請求項1 に記載の光部品実装用基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光半導体素子や光学素子等の光部品を基板上に搭載するための光部品実装用 基板及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光通信システムの大容量化及び多機能化が求められており、それに伴って光送信器や光受信器等の光デバイスの小型化、高集積化、及び低コスト化が要望されている。特に光デバイスの組み立てコストを削減する目的で、同一基板上に光半導体素子や光ファイバ、レンズ等の光学素子を搭載する技術、いわゆる光ハイブリッド実装技術やシリコンプラットフォーム等の技術が注目されている。

【0003】上記技術によれば、例えば基板に形成された導体パターンに光半導体素子を実装し、同一の基板上 30 に形成されたV溝に光導波体である光ファイバ、光ファイバ内蔵のフェルール、又はファイバスタブを実装するだけで無調心にて光軸調整が行え、組み立てコストを大幅に削減することが可能であるとされている。

【0004】基板上に無調心で光部品の実装を可能にするには、例えば基板に形成した光半導体素子搭載用の電極と光ファイバ搭載用のV溝、またはこのV溝と光半導体素子搭載用の位置合わせマーカーとが各々高精度に形成され、且つそれぞれにおける両者の位置関係がサブミクロンオーダーの精度で形成されていなければならない。

【0005】このようなシリコンプラットフォームの製作方法について、図4に基づき説明する。図4(a)~(h)は、それぞれ従来の光部品実装用基板の製作工程を説明する平面図である。

【0006】まず、図4(a)に示すように、所定の方位を主面とする単結晶のシリコン基板41上にシリコン酸化膜やシリコン窒化膜等のシリコンエッチング液に対して耐性を有する膜を被着形成し、V溝形成用のフォトマスクを用い、フォトリソグラフィーにより上記膜をパタ 50

ーニングしシリコン基板 4 1 の露出面 4 1 a を有した V 溝パターン 4 2 を得る。

【0007】次に図4(b)に示すように、V溝形成用パターン42をマスクとして、水酸化カリウム水溶液や水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液等のエッチング液により、図4(a)における露出面41aをエッチングし、異方性エッチングによりV溝43が形成される。

【0008】次に図4(c)に示すように、図4(b)におけるV溝形成用パターン42をいったん除去した後にV溝43を含むシリコン基板41の一主全体に、熱酸化法もしくはスパッタ法やプラズマCVD法等により、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜等の絶縁膜44を形成する。

【0009】次に図4(d)に示すように、後記する電極や光半導体素子実装用マーカーを形成するためのフォトマスクを用いることにより、電極形成領域45や光半導体素子実装用マーカー形成領域46を除く領域にフォトレジストパターン47を形成する。

【0010】次に図4(e)に示すように、シリコン基板 41の一主面側の全面に電極材料となる金等の金属膜4 8を蒸着法等により被着形成する。

【0011】次に図4(f)に示すように、リフトオフ法により図4(d)における電極形成領域45や光半導体素子実装用マーカー形成領域46を除く領域のフォトレジストパターン47を除去し後述する光半導体素子搭載部を含む電極パターン49及び光半導体素子実装用マーカー50を形成する。

【0012】そして、図4(g)に示すように、電極パターン49の光半導体素子搭載部51に半田を塗布形成し、しかる後に図4(h)に示すように、ダイシングにより光ファイバの突き当て用矩形溝52、及びシリコン基板51の端面51aにおいて切断を行うことにより、不図示の光半導体素子を実装するための光半導体素子搭載部51、及び不図示の光ファイバを実装するためのV溝53を同一のシリコン基板41に形成した光部品実装用基板Jが完成する(例えば、特開平11-109184号公報を参照)。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記方40 法では以下に示すような問題点がある。

【0014】 ② V 溝と直角に交わる光ファイバの突き当て用矩形溝の形成方法が切削加工であるために、加工による溝位置の精度が良好でなく、発光素子搭載用の電極パターンに近接した加工が困難である。

【0015】また、切削加工では突き当て面にチッピングのような基板の欠落が多く、高精度な突き当て面の形成が困難であり、結合効率を低下させる要因となる。

【0016】 ②突き当て用矩形溝が光部品実装用基板を 縦断して形成されているために、矩形溝部分が機械的に 弱く、光部品実装用基板をパッケージに固定する際や、 光モジュール完成後の温度変化等により、光部品実装用 基板に熱変形が生じ易く、光半導体素子と光ファイバ間 の位置ずれにより結合効率を低下させる要因となる。

【0017】そこで本発明は、上述の諸問題を解消する とともに、同一基板上に搭載する半導光体素子と光導波 体との光結合を高効率かつ安定に行うことが可能で、し かも小型化可能で信頼性にも優れた光部品実装用基板、 及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0018]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の光部品実装用基板は、基板に、光導波体を 搭載するV溝と、該V溝の一端部に前記光導波体の端部 位置を定めるための貫通孔が形成されていることを特徴 とする。特に基板は異方性エッチングが可能な材料から 成り、V溝及び貫通孔を異方性エッチングで形成したこ とを特徴とする。

【0019】また、本発明の製造方法は、基板の表面か らの異方性エッチングによりV溝を形成する工程と、V 溝の一端部に対応する基板裏面の部位からの異方性エッ チングにより貫通孔を形成する工程とを順次行うことを 20 特徴とする。

【0020】ここで、V溝の一端部に前記光導波体の一 部を当接させるために、基板の裏面側から孔径が徐々に 狭くなったテーパ状の貫通孔とするとよい。

【0021】また、裏面からの異方性エッチングで貫通 孔を形成するのは、貫通孔と基板の表面からなる基板の オーバーハング形状のエッジ部へ光導波体の端面を当接 させるためであり、表面から形成した場合は、光導波体 の端面の当接ができず、安定な構成を得ることができな いからである。

【0022】これにより、異方性エッチングによるV溝 と貫通孔の同時一括形成時に両者の接続部に発生する形 状の崩れがなく、また基板表面のV溝を短時間のエッチ ング処理で高精度に形成し、貫通孔形成時の長時間のエ ッチング処理中は、基板表面のV溝を耐エッチング膜で 保護しているため、V溝の高精度維持が可能である。

[0023]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係わる実施形態 について図面に基づき詳細に説明する。

【0024】図1(a)に本発明に係わる光部品実装用 基板S1の上面図(平面図)を、図1(b)に(a)の b-b断面図、図1 (c) に下面図(裏面図)を示す。 【0025】図1に示すように、光部品実装用基板S1 は、基板1の表面1aに、光ファイバや光導波路体のよ うな光導波体Fを位置決め搭載するV溝2が形成された ものであり、V溝2の一端部2aに接続するように、基 板1の裏面1cから表面1aへ孔径が徐々に狭くなった テーパ状の貫通孔3が形成されており、この貫通孔3の 端部において光導波体Fの端部位置を定めている。すな わち、基板1の表面1aと貫通孔3とで形成されるエッ 50

ジ部を光導波体Fの突き当て部4aとし、光導波体Fの 一端部Faを突き当て部4aに当接させることにより高 精度の位置決めが可能となる。尚、図中5、6はそれぞ れ光半導体素子搭載用の電極パターンであり、5は例え ば発光素子、6はモニター用受光素子を搭載する電極パ ターンである。図中7は基板1の裏面1cに貫通孔3の パターンを形成する際に使用するマスク合せ用のマーカ ーである。

【0026】次に、図2(a)~(e)に示す模式的な 端面図 (図1 (b) に相当する端面図であり、簡単のた め断面図でなく端面図で示す) に基づき、本発明の光部 品実装用基板の製作工程(エッチング工程)例を説明す

【0027】まず、図2(a)に示すように、例えば異 方性エッチングが可能な材料である単結晶シリコンから なる基板21上に、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜等 からなる第1のエッチングマスク膜22を被着形成し、 表裏面マスクアライナーを用いたフォトリソグラフィー により基板表面のV溝23(パターンは23a)と裏面 のマーカー24 (パターンは24a) のパターンニング を行う。

【0028】次に、図2(b)に示すように、水酸化ナ トリウム水溶液や水酸化カリウム水溶液等のエッチング 液による異方性エッチングで基板表面のV溝23と裏面 のマーカー24を形成する。

【0029】次に、図2(c)に示すように、エッチン グマスク膜22を除去した後に、再度第一と同様の第二 のエッチングマスク膜25を被着形成し、図2(d)に 示すように裏面のマーカー24を使用し、マスク合わせ により裏面におけるV溝23の一端部に対応する部位に 貫通孔26 (パターンは26a) のパターニングを行

【0030】その後、図2(e)に示すように、異方性 エッチングにより貫通孔26を形成し、第二のエッチン グマスク膜25を除去することにより、所望の形状を有 する基板27が完成する。

【0031】かくして、上記光部品実装用基板によれ ば、光導波体を搭載するV溝と、光導波体を当接させる 突き当て部をエッチングプロセスにて高精度に形成する ことができ、従来のV溝の一端部に形成させる突き当て 用矩形溝の切削加工を不要とし、光部品実装用基板の製 作工程の簡略化が図れる。

【0032】また、従来の矩形溝を不要とすることで、 光導波体を当接させる突き当て部と光半導体素子搭載用 の電極パターンを近接して配置でき、またチッピングの ような基板の欠落も防げることから、高精度な部品実装 用基板を提供できる。

【0033】さらに、矩形溝の壁への面突き当てから、 貫通孔と基板の表面からなるエッジ部への線突き当てに できることから、面精度の問題も解消できる。

30

【0034】そして、上記光部品実装用基板を縦断する 矩形溝がないために、機械的強度にも優れ、パッケージ への光部品実装用基板の固定時や、光モジュール完成後 の温度変化等による熱変形が生じにくく、安定した光結 合が実現できる。

【0035】また、本発明の光部品実装用基板の構造において、基板裏面の全面に電極膜を形成し、貫通孔を介して導通をとれば、パッケージへの固定の際にグランドの強化として利用することも可能である。

【0036】なお、基板1は異方性エッチングが可能な 10シリコン単結晶が最も好適に使用可能であるが、各種のガラスやセラミックス等、その他の材料を適宜に選択が可能である。また、V溝2に載置する光導波体Fは光ファイバ以外の、屈折率の互いに異なるコア部とクラッド部を有する光導波路とすることも可能である。

[0037]

【実施例】以下に、本発明のより具体的な実施例について説明する。

[実施例1] 図1に示すように、光部品実装用基板S1 は、基板1の主面が (100) 面、厚さ約500 μ mの 20 単結晶のシリコンを用いた。 V溝2は異方性エッチングにより形成しその斜面が (111) 面であり、 V溝2の幅は外径125 μ mの光ファイバFをV溝2に搭載した時に、発光素子との光軸が一致するように140.3 μ mとした。

【0038】また、貫通孔30形状は、光部品実装用基板S1の表面1aの寸法で、V溝2に平行な方向が70 μ m、垂直は方向は光ファイバFの外径より大きければよく150 μ mとした。ちなみに裏面1cの寸法は、結晶学的に778 μ m×858 μ mと決まる。光部品実装 30 用基板S1では、光ファイバ突き当て部4a と発光素子搭載用の電極パターンの間隔を 5 ± 1 μ mで形成できた。

【0039】本発明によれば、光ファイバ突き当て部4 a と発光素子搭載用の電極パターンの間隔をなくすことが可能である。

[実施例2]本発明の光部品実装用基板によれば、従来、光部品実装用基板を縦断して形成されていた矩形溝がないために、光導波体を搭載するV溝の近傍まで電極パターンの引き回しが可能となり、光部品実装用基板の40小型化を図ることができる。このような実施例を以下に説明する。尚、上記光部品実装用基板S1と同様な構成については同一符号を付し、この説明を省略する。

【0040】図3に示すように、電極パターン5、6の配線をV溝2側に引き回すことで、光部品実装用基板S2のサイズは従来の2/3程度に小さくすることが可能となった。ここで、貫通孔3の寸法は $70\mu m \times 14$

0. 3μ mとした。

【0041】さらに、光導波体を搭載するV構2の近傍の空スペースには、チップ抵抗やコンデンサ、IC回路等(不図示)も搭載が可能である。

[0042]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明の光部品実 装用基板及びその製造方法によれば、以下に示す顕著な 効果を奏することができる。

【0043】 ①光導波体を搭載するV溝と、光導波体を 当接させ端部位置を定めるための突き当て部(貫通孔 部)をエッチングプロセスにて高精度に形成することが でき、従来のV溝の一端に形成される矩形溝の切削加工 工程を不要とし、光部品実装用基板の製作工程の簡略化 が図れる。

【0044】②従来の矩形溝を不要としたために、光導波体を当接させる突き当て部と光半導体素子搭載用の電極パターンを近接して配置でき、光導波体と発光素子の高い結合効率を得ることができる。

【0045】 ③エッチングにより形成された貫通孔と基板の表面で構成されるエッジ部へ光導液体を当接させるため、従来の矩形溝のチッピングや面精度の問題を解消することができる。

【0046】

④従来の矩形溝がないために、光導波体を搭載するV溝の近傍まで電極パターンの引き回しができ、さらにはV溝の近傍にIC回路等の搭載も可能となり、光部品実装用基板の小型化を図ることができる。

【0047】 **⑤**従来の矩形溝を不要としたために、光部品実装用基板自体はもとより、光モジュールとしても機械強度、耐環境性に優れ、信頼性を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明に係る光部品実装用基板の一実施形態を模式的に説明する図であり、(a)は上面図(平面図)、(b)は(a)のb-b線断面図、(c)は下面図(裏面図)である。

【図2】(a)~(e)は、それぞれ本発明に係る光部品実装用基板の製造工程を模式に説明する端面図である。

【図3】本発明に係る光部品実装用基板の他の実施形態 を模式的に説明する上面図(平面図)である。

【図4】(a)~(h)はそれぞれ、従来の光部品実装用基板の作製工程を説明する平面図である。

【符号の説明】

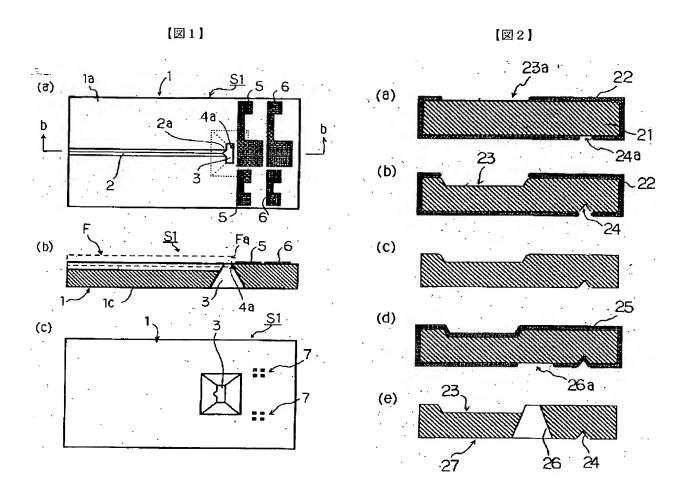
1:基板

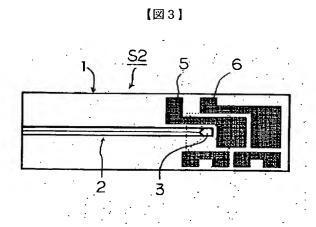
2: V溝

3:貫通孔

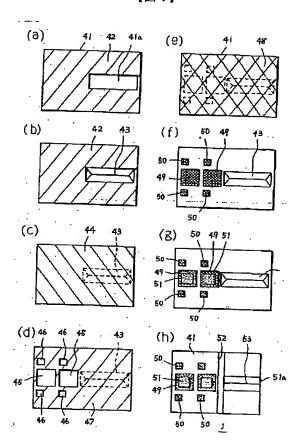
F:光導波体

S1, S2:光部品実装用基板





【図4】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BL	ACK BORDERS
□ ім	AGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FA	DED TEXT OR DRAWING
☐ BL	URRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ ѕк	EWED/SLANTED IMAGES
Z co	LOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GR	AY SCALE DOCUMENTS
LI	NES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ RE	FERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
От	HER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.